DIN EN 1071-1:2003-06 (D)

Hochleistungskeramik - Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten - Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit einem Kontaktprofilometer; Deutsche Fassung EN 1071-1:2003

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Grundlagen des Verfahrens 3

4 Geräte 3

5 Probenahme und Vorbereitung der Proben 4

6 Durchführung 4

7 Grenzen für die Stufenhöhe 5

8 Wiederholpräzision 5

9 Prüfbericht 5

Anhang A (informativ) Einfluss des Verstärkungsfaktors und der Nivellierungsabweichung auf die gemessene Schichtdicke 8